**Експериментальні методи дослідження наносистем**

1. Фізичні принципи мікроскопії ближнього оптичного поля та її застосування для дослідження морфології наносистем.
2. Фізичні принципи електро- та магнітносилової зондової мікроскопії. Застосування методу для визначення локальних електричних та магнітних характеристик нанооб’єктів.
3. Метод малокутового розсіювання рентгенівських променів. Кореляційна функція та функція розподілу. Застосування методу для дослідження морфології наносистем.
4. Метод сканувальної тунельної мікроскопії: фізичні принципи та можливості визначення фізичних характеристик наносистем.
5. Фізичні принципи атомно-силової мікроскопії поверхні. Визначення рельєфу поверхні, локальних діелектричних характеристик та електронної будови наноматеріалів.